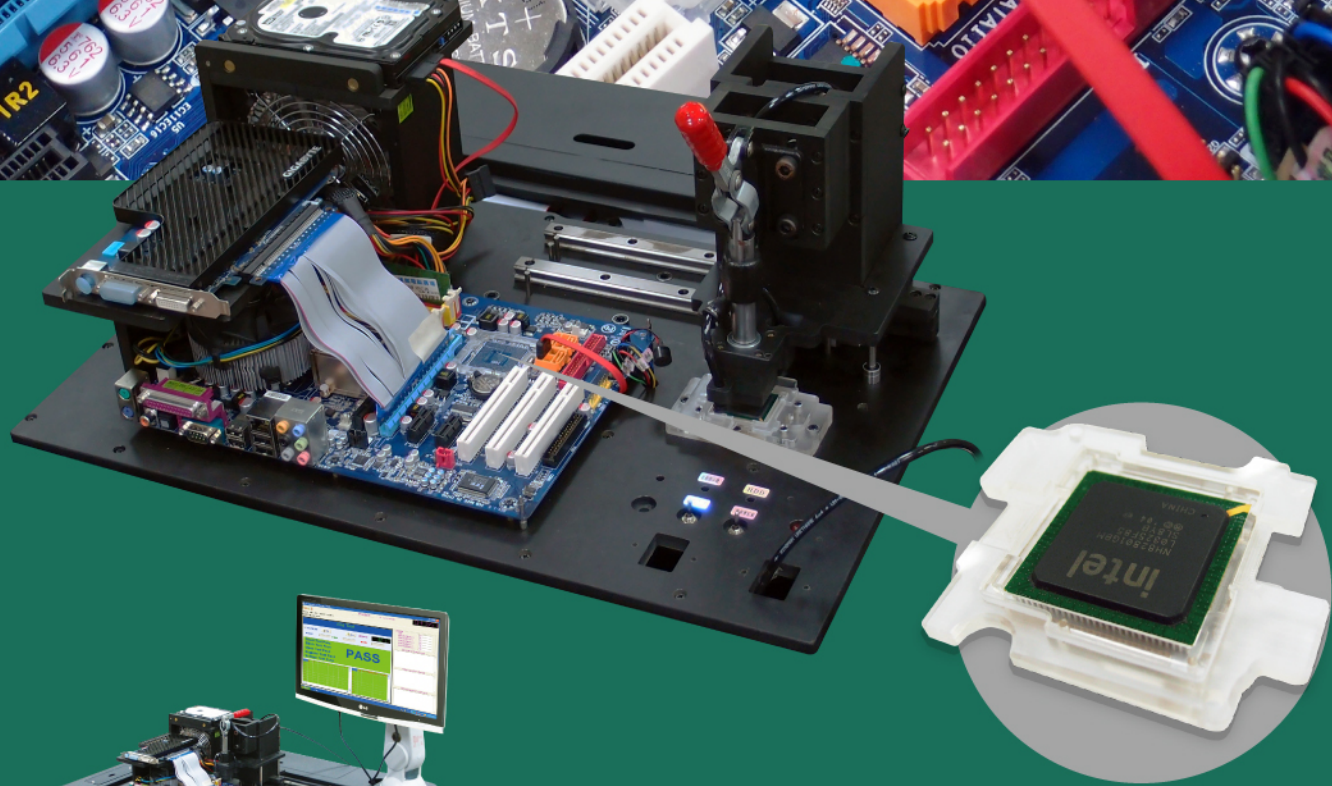
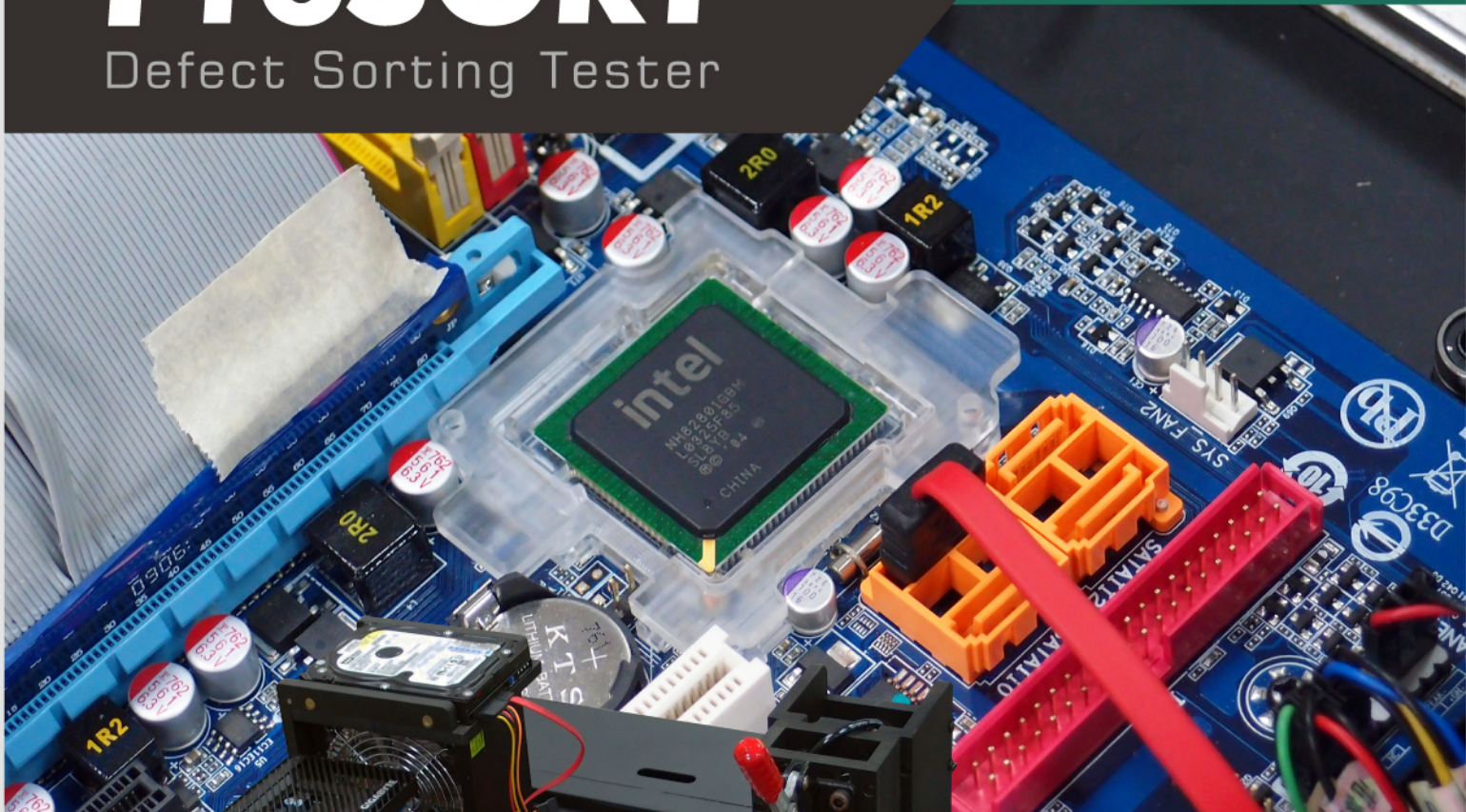


ProSORT

Defect Sorting Tester

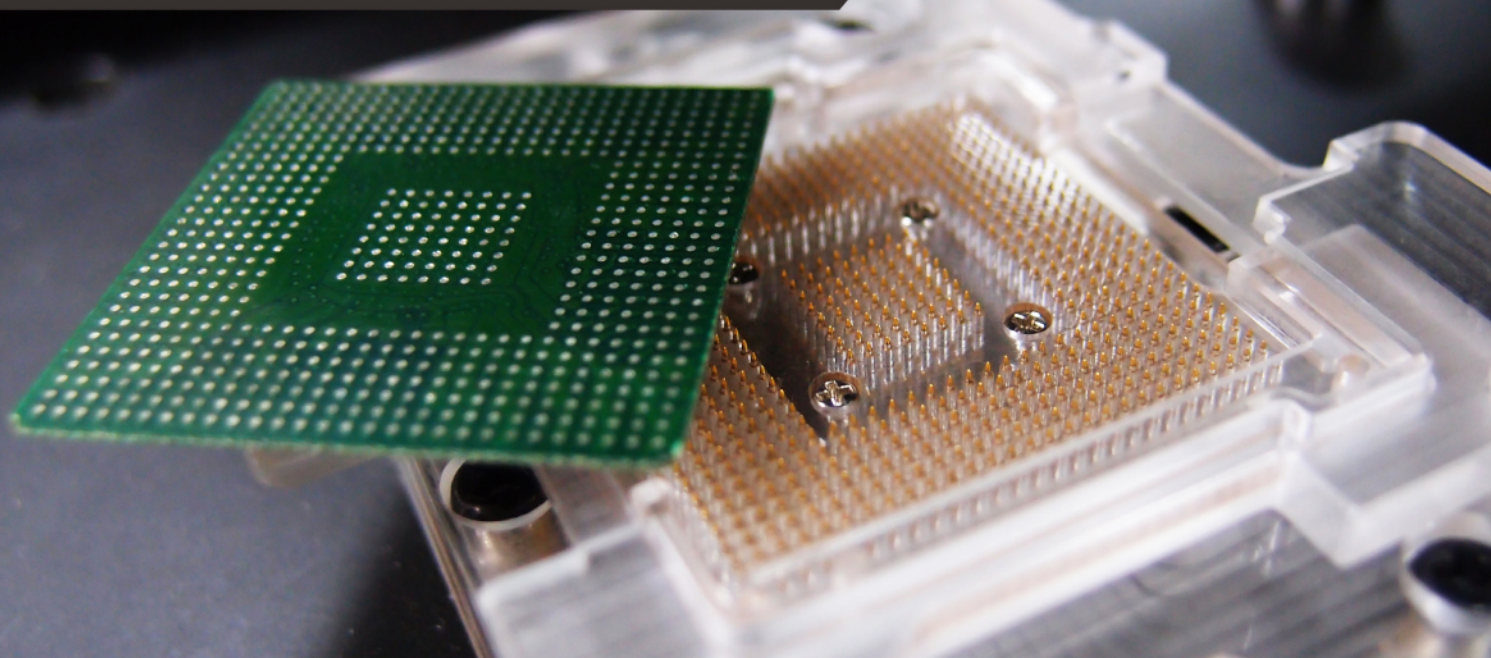


ProSORT around the workshop

新世代的測試設備 Pro-IC Defect Tester 可完全檢驗所有的 IC, BGA 等積體電路晶片的功能是否有缺陷，搭配獨特的四線式量測模組專利及特殊設計的測試探針可以快速測試及驗證每顆 IC 的特性，可用於進料檢驗及 RMA 維修料件驗證。

ProSORT

Defect Sorting Tester



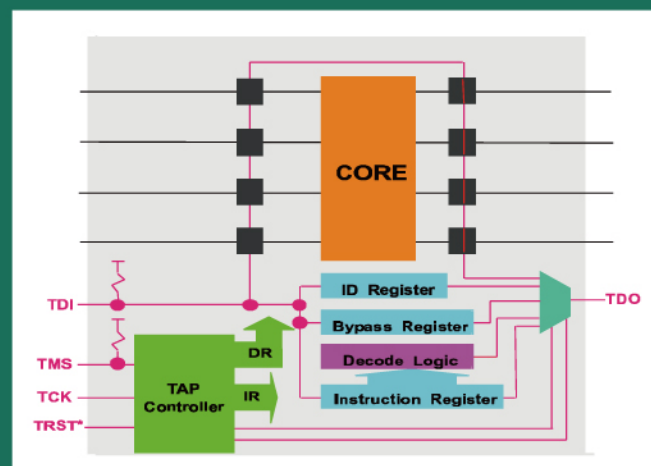
設備特點：

- ▶ 程式製作為自我學習模式，簡單易懂
- ▶ 測試時間快速，V/I 量測模組判斷
- ▶ IC 測試夾具製作簡易，經濟實惠並可設計為泛用型 IC 測試治具
- ▶ BGA 封裝類晶片缺陷篩選模式，快速驗證晶片好壞
- ▶ OCT 測試模組，100% 安全性測試平台

產品功能：

- ▶ 所有廠牌 IC 晶片內部功能測試
- ▶ 所有廠牌 IC 晶片邏輯電路分析驗證
- ▶ 所有廠牌 IC 晶片區塊電壓測試，暫存器驗證
- ▶ 所有廠牌 IC 晶片 Net list 學習模式，晶片
- ▶ 內部晶線 open/short 判斷

BGA Register Test



Specification

1. Model : ProSORT
2. 測試點數 : 1 ~ 1024 / 1 ~ 2048點
3. O/S 測試電壓 : 0.1V ~ 0.27V
4. 測試電流 : 0.1mA
5. 量測信號模式 : 4Wire
6. Power supply : 110V /220V 可切換式
7. Display type : 15" LDC Monitor
8. 機器重量 : 約80公斤